

همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه

National e-Conference on Advances in Basic Sciences and Engineering

WWW.AEBSCONF.IR



مشخصه‌یابی نانولایه‌های نقره انباسته شده بر بستر نانولوله‌های کربنی چنددیواره عمودی (Ag/VA-MWCNTs) بوسیله طیفسنجی رامان

معرفت خدائی، فرشید^۱؛ برقعی، سید مجید^۲

۱. گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران

۲. گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز

چکیده

در این پژوهش به منظور رشد عمودی نانولوله‌های کربنی از روش PECVD بر روی زیرلایه‌ی سیلیکونی و بواسطه‌ی کاتالیست نیکل استفاده کردیم. لایه‌نشانی نقره به روش کندوپاش DC در ضخامت‌های ۳۵، ۶۰، ۸۵ و ۱۰۰ نانومتر بر بستر نانولوله‌های کربنی صورت پذیرفت. ساختار به دست آمده را با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) و روش طیفسنجی رامان مورد شناسایی و تغییرات ساختاری و خواص الکتریکی را مورد بررسی قرار دادیم.

کلمات کلیدی: نانولوله کربنی چنددیواره عمودی، لایه‌نشانی نقره، کندوپاش DC، طیفسنجی رامان.

مقدمه

علم نانو بعدی پدیده‌ها، ویژگی‌ها و نتیجه‌گیری از مواد را در ابعاد اتمی، مولکولی و ماکромولکولی و بطور کلی در اندازه‌هایی بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر مطالعه می‌کند. در این ابعاد، به ویژه در کمتر از ۵ نانومتر، خواص ماده بطور قابل توجهی از آن ماده‌ای که ابعاد ذره‌ای بزرگتری دارد، متفاوت است به عنوان مثال: تاثیرات ابعاد کوانتومی نقش مهمی را بازی می‌کنند. نانومواد با ویژگی‌های منحصر به فرد همانند: نانوذرات نانولوله‌های کربنی، فولرن‌ها، نقاط کوانتومی، سیم‌های کوانتومی، نانوفیربرها و نانوکامپوزیت‌ها بطور کامل برای کاربردهای جدید بکار روند (لوگو تدیدیس، ۲۰۱۲).

یک نوع از آلتوروب‌های کربن، نانولوله‌های کربنی هستند که در سال ۱۹۹۱ به وسیله سومیو ایجیما و همکارانش، هنگام تبخیر شدن کربن در قوس الکتریکی کشف شد. نانولوله‌های کربنی خواص بسیار منحصر به فردی دارند که آن‌ها را برای بکارگیری در بسیاری از کاربردهای نانوفناوری، الکترونیک، اپتیک و حوزه‌های دیگر علم مواد مناسب می‌سازد (نراقی، ۲۰۱۱). یکی از موضوعات مورد علاقه در پیروی از نانولوله‌های کربنی افزودن نانوذرات به آن‌ها می‌باشد. معروفی نانوذرات فلزی به ماده کربنی ساختار الکترونی آن‌ها را اصلاح کرده و در نتیجه‌ی می‌توان ویژگی‌های الکترونیکی نانولوله‌های کربنی را با تغییر اندازه و غلظت نانوذرات فلزی گنجانده شده کنترل کرد. اخیراً نانوذرات طلا، پلاتینیوم و نقره با استفاده از روش‌هایی نظریاً کسیداییون شیمیایی، لایه‌نشانی الکترواستاتیک یا جذب فیزیکی بر روی نانولوله‌های کربنی چند دیواره افزوده شده‌اند (کاپک، ۲۰۰۹).

نقره با خواصی همانند چکش خواری، بازتاب کنندگی و جلا، رسانندگی الکتریکی بالا و آنتنی باکتریال بودن با نشستن بر روی بستر نانولوله‌های کربنی می‌تواند به خواص آنها بیافاید (وات، ۲۰۰۳؛ بلوال، ۲۰۰۷). تشكیل لایه‌های نقره بر روی نانولوله‌های کربنی هم کاربردهای مختلفی از قبیل: جذب گازهای مولکولی (باربیو و همکاران، ۲۰۱۴)، بهبود خواص گسیل میدانی (شنگ جویانگ و همکاران، ۲۰۱۳)، افزایش فعالیت‌های آنتنی میکروپی (موهان و همکاران، ۲۰۱۱) و بیوسنسورها (جاگریتی و همکاران، ۲۰۱۲) را به دنبال داشته‌اند.

طیفسنجی رامان روش طیفسنجی بر اساس پراکنده‌گی ناکشسان نور تک رنگ که معمولاً از یک منبع لیزر ناشی می‌شود، است. طیفسنجی رامان اطلاعاتی در زمینه خلوص، وجود نواقص و جهت‌گیری و نظم نانولوله‌ها در اختیار ما قرار می‌دهد و همچنین می‌تواند در تشخیص حضور نانولوله‌های کربنی چنددیواره در میان سایر آلتوروب‌های کربن به ما کمک کند (لمن و همکاران، ۲۰۱۱).

مواد و روش آزمایش

در گام نخست، زیرلایه‌های سیلیکونی با ابعاد $1\text{cm} \times 1\text{cm}$ را به منظور فراهم شدن شرایط رشد مطلوب به روش تمیزکاری RCA از آلودگی‌ها پاک کردیم. بدین صورت که زیرلایه‌ها را با محلولی شامل یک واحد آمونیاک، یک واحد آب اکسیژنه و پنج واحد آب دیونیزه شده شستشو داده و با هوا خشک کردیم. در گام بعدی، به دلیل اینکه در روش لایه‌نشانی بخار شیمیایی با استفاده از پلاسمای فزاینده (PECVD) برای رشد نانولوله‌های کربنی وجود کاتالیست لازم است، لایه نازکی از نیکل به ضخامت ۹ نانومتر را در دمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد با استفاده از سیستم باریکه الکترونی به روی زیرلایه‌ها نشاندیم. در ادامه نانولوله‌های کربنی توسط دستگاه DC-PECVD رشد یافتند، بدین شرح که: پس از رساندن خلاء دستگاه به 10^{-5} Torr ، دمای نمونه داخل لوله کوارتز دستگاه را به 650°C رساندیم و به مدت ۱۵ دقیقه همراه با دمیدن گاز هیدروژن با فلوي sccm ۲۰ در همان دما ثابت نگه داشته شد تا جزایر نانومتری نیکل در آستانه‌ی تشکیل قرار بگیرند. وجود جایگاه‌های نانومتری در سطح کاتالیست برای رشد نانولوله‌ها لازم است. با روشن کردن پلاسمای DC، این مرحله با پلاسمای هیدروژن (با جریان 30 mA و ولتاژ 500 V) به مدت ۵ دقیقه در همان دمای 650°C ادامه یافت تا اتم‌های نیکل دارای انرژی جنبشی لازم برای ادغام با یکدیگر را بیابند و یون‌های نیکل با ورود به لایه‌های نیکل آمورف باعث بلوری شدن آن شود. بدین ترتیب در دما و شرایط پلاسمایی مناسب جزایر نانومتری به وجود می‌آیند. در مرحله پایانی نیز گاز

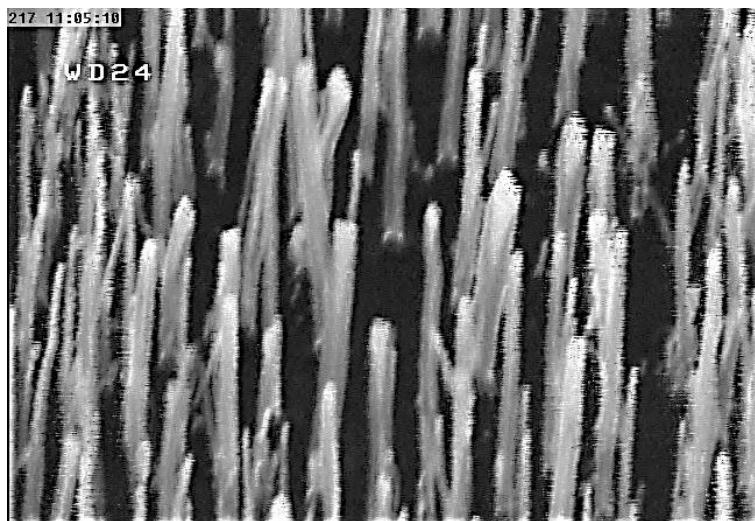
همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه

National e-Conference on Advances in Basic Sciences and Engineering

WWW.AEBSCONF.IR



استیلن (C_2H_2) با فلوی $4/5 \text{ sccm}$ به عنوان منبع کربن دهی وارد سیستم شد. جریان ولتاژ در این حالت به ترتیب 32 mA و 600 V و زمان رشد مطلوب CNT ها $15-25 \text{ دقیقه}$ بود. تصویر گرفته شده با میکروسکوپ الکترونی رویشی گسیل میدانی (FESEM) یکی از نمونه ها را شکل ۱ نشان می دهد.



شکل ۱- تصویر میکروسکوپ FESEM از نanolوله های کربنی رشد یافته.

همان طور که در شکل مشاهده می شود نقاط روشن در انتهای نanolوله های کربنی نشان دهنده وجود ذرات نیکل هستند که در طول رشد نanolوله بالا رفته اند و همچنین نشان دهنده مکانیزم رشد از روی کاتالیست (Tip Growth) می باشد. در آخرین گام سنتز نمونه، لایه نشانی نقره را با استفاده از دستگاه کندوپاش مغناطیسی با جریان مستقیم انجام دادیم. شرایط آزمایشی این مرحله در جدول ۱ آورده شده است.

جدول ۱- شرایط آزمایشی لایه نشانی نقره.

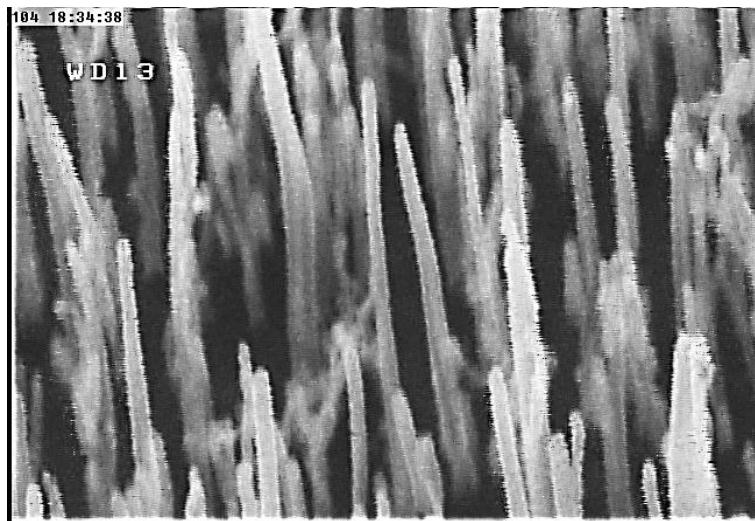
| | |
|----------------------|----------------------------|
| $6/2 \times 10^{-5}$ | فشار پایه (mbar) |
| 5×10^{-2} | فشار کاری (mbar) |
| ۱۴ | جریان (mA) |
| ۶۰ | ولتاژ (V) |
| ۳۳ | دما جین لایه نشانی (°C) |
| ۸ | فاصله زیر لایه تا هدف (cm) |
| ۱۰۰، ۸۵، ۶۰، ۳۵ | ضخامت لایه نشانی (nm) |
| آرگون | نوع گاز |
| نقره | ماده هدف |

تصویر FESEM از نanolوله های کربنی پوشیده شده با نقره، با ضخامت لایه نشانی 100 نانومتر در شکل زیر آورده شده است.

همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه

National e-Conference on Advances in Basic Sciences and Engineering

WWW.AEBSCONF.IR



شکل ۲- تصویر میکروسکوپ FESEM از نانولوله‌های کربنی پوشیده شده از نقره (با ضخامت لایه‌نشانی ۱۰۰ نانومتر).

نتایج و بحث

به کمک تصاویر بدست آمده از میکروسکوپ FESEM می‌توان در مورد مورفولوژی ساختار سنتر شده گفت که ساختار لوله‌ای شکل نانولوله‌های کربنی تا ضخامت لایه‌نشانی ۱۰۰ نانومتری نقره حفظ می‌شود و با افزایش ضخامت در لایه‌نشانی نقره بر قطر و ارتفاع نانولوله‌ها افزوده می‌شود.

طیف‌سنجی رامان نقش مهمی را در مطالعه و شناسایی مواد گرافیتی و ساختارهای کربنی با هیبرید² sp دارد. طیف رامان نانوساختارهای کربنی ویژگی‌های مختلفی دارند از جمله: ۱- باند G که گروهی از پیک‌ها در محدوده $1600-1550\text{ cm}^{-1}$ ، ناشی از کشش پیوند کربن-کربن در مواد گرافیتی و مربوط به ارتعاشات مماسی اتم‌های کربن هستند. این باند به طور معمول در تمام سیستم‌های کربنی² sp وجود دارد و معیار خوبی برای تعیین میزان گرافیتی بودن نمونه است. ۲- باند G' که در محدوده $2800-2500\text{ cm}^{-1}$ نمایان می‌شود، همراه با باند G خصیصه گرافیتی مواد هیبریدی² sp می‌باشد. باند G' از یک فرایند پراکنش دوفونونی درجه دوم نشأت می‌گیرد و واستگی فرکانسی زیادی با انرژی لیزر پرانگیختگی دارد. این باند نشان‌دهنده وجود نظم در محدوده وسیعی از ماده است. ۳- باند D در محدوده 1340 cm^{-1} که حضور بی‌نظمی در ماده گرافیتی را نشان داده و به ارتعاشات نواقص شبکه گرافیتی نانولوله‌های کربنی مربوط می‌باشد (سایتو و همکاران، ۲۰۱۱؛ لمن و همکاران، ۲۰۱۱؛ درسل‌هاست و همکاران، ۲۰۱۰).

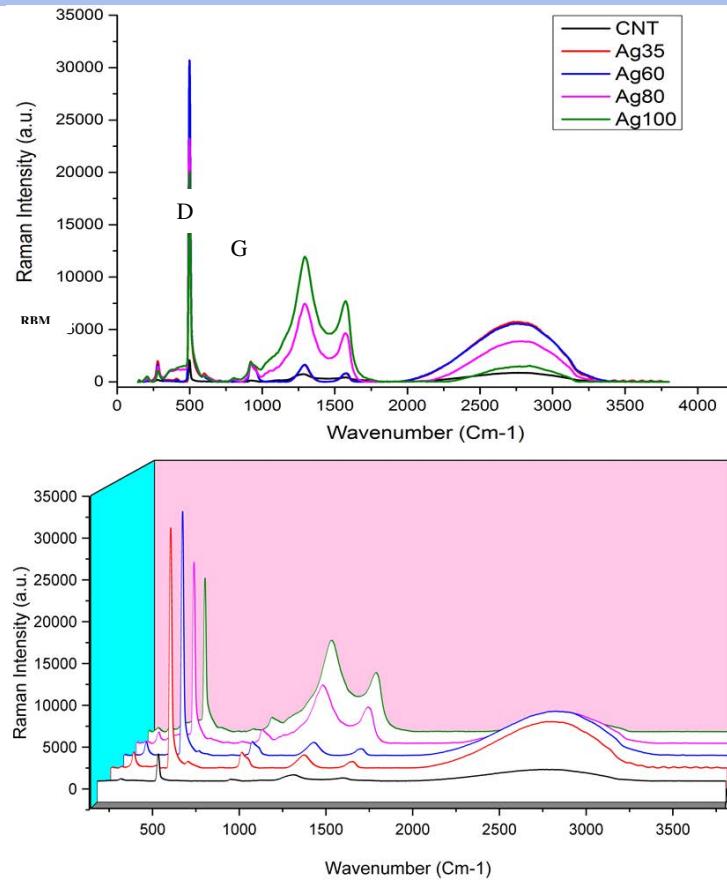
با مقایسه طیف‌های رامان مواد کربنی مختلف با هیبرید² sp می‌توان به نوع ساختار کربنی پی‌برد. به دلیل بالا بودن دمای ذوب گرافیت (بالای 4200 K) و چون هیچ ماده کربنی واقعی بدون نقص نیست، نسبت شدت باند D/G (I_D/I_G) متريک حساس به درجه بی‌نظمی مواد کربنی² sp در بازه گستره‌های از دما می‌باشد (سایتو و همکاران، ۲۰۱۱). همچنین انتظار می‌رود با کاهش نسبت I_D/I_G بار مؤثر سطح افزایش یافته و رسانندگی الکتریکی افزایش یابد (ویکتور و همکاران، ۲۰۰۳).

طیف‌سنجی رامان را با استفاده از دستگاه طیف‌سنجی Raman آزمایشگاه مرکزی نانو دانشگاه تهران مدل SENTERRA انجام دادیم. این دستگاه مجهز به دیودهای لیزری بالا است که تابیش‌های لیزری مرئی و غیرمرئی نزدیک به منطقه مادون قرمز را منتشر می‌کنند. طول موج لیزر این دستگاه 785 nm می‌باشد و محدوده طیفی $2000-3500\text{ cm}^{-1}$ را شامل می‌شود. این آنالیز را برای ۴ نمونه با لایه نشانی مختلف نقره و ۱ نمونه بدون این لایه‌نشانی مورد شناسایی قرار دادیم. نمودار طیف‌های گرفته شده بصورت دو بعدی و سه بعدی برای مشخص‌تر شدن تغییراتشان در شکل ۳ آمده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود پیکی که در 280 cm^{-1} داریم مربوط به حالت تنفس شعاعی (RBM) می‌باشد که دال بر وجود نانولوله‌های کربنی چند دیواره‌ی با خلوص بالا، نقص پایین و لایه‌های داخلی بسیار باریک است. پیک بلندی که در طول موج 500 cm^{-1} مشاهده می‌شود مربوط است به زیرلایه سیلیکون که می‌توان از آن صرف‌نظر کرد. شدت پیک‌های مربوط به باند D و باند G با افزایش ضخامت لایه‌نشانی نقره بیشتر شده است. با توجه به طیف نانولوله کربنی (بدون لایه‌نشانی نقره) می‌توان دریافت که اضافه شدن نقره به ساختار نانولوله‌های کربنی میزان نواقص را در آن‌ها افزایش می‌دهد. آخرین پیک در محدوده 2700 cm^{-1} باند G' را نشان داده و می‌بینیم با افزایش ضخامت لایه نقره بر روی نانولوله‌های کربنی، شدت این پیک کاهش می‌یابد.

همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه

National e-Conference on Advances in Basic Sciences and Engineering

WWW.AEBSCONF.IR



شکل ۳- طیف رامان نمونه‌ها، بصورت دوبعدی و سه بعدی.

اطلاعات مربوط به موقعیت پیک‌های D و G، شدت هر یک از آنها و نسبت این شدت‌ها در جدول ۲ آورده شده است. داده‌های جدول ۲ نشان می‌دهند که با نشاندن نقره بر روی نانولوله‌های کربنی نسبت I_D/I_G کاهش یافته و با افزایش بیشتر ضخامت نقره لایه‌نشانی شده باز هم این نسبت کاهش می‌یابد.

جدول ۲- اطلاعات طیف رامان مربوط به پیک‌های D و G، شدت و نسبت آن‌ها.

| نمونه | پارامتر | | | | |
|--------|-----------|---------|----------|--------|--------|
| | I_D/I_G | I_G | I_D | G باند | D باند |
| CNT | ۲/۰۵۶ | ۳۶۴/۱۳ | ۷۴۸/۷ | ۱۵۷۴ | ۱۲۸۱/۵ |
| Ag-35 | ۲/۰۳۴ | ۷۸۷/۰۳ | ۱۰۶۱/۳۲ | ۱۵۷۸/۵ | ۱۲۸۹/۵ |
| Ag-60 | ۱/۹۸۵ | ۸۲۴/۵۱ | ۱۶۳۷/۲۲ | ۱۵۸۰/۵ | ۱۲۹۲/۵ |
| Ag-80 | ۱/۶۰۶ | ۴۶۴۴/۴۴ | ۷۴۶۰/۴۴ | ۱۵۷۲ | ۱۲۹۲/۵ |
| Ag-100 | ۱/۵۴۷ | ۷۷۱۳/۸۵ | ۱۱۹۳۹/۲۸ | ۱۵۷۳/۵ | ۱۲۹۳ |

داده‌های جدول ۲ نشان می‌دهند که با نشاندن نقره بر روی نانولوله‌های کربنی نسبت I_D/I_G کاهش یافته و با افزایش بیشتر ضخامت نقره لایه‌نشانی شده باز هم این نسبت کاهش می‌یابد. با افزایشی که در این نسبت داشتیم، می‌توان فهمید که:

- ۱- نواقص ساختاری نانولوله با نشستن هر چه بیشتر نقره در محل حفرات موجود در نانولوله بعضی از این نواقص را پوشانده و باعث کاهش نواقص آن می‌شود.
- ۲- با کاهش I_D/I_G بار مؤثر سطح افزایش یافته و رسانندگی الکتریکی نیز افزایش می‌یابد.

همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه

National e-Conference on Advances in Basic Sciences and Engineering

.... WWW.AEBSCONF.IR



منابع مورد استفاده

- Logothetidis, S. 2012. Nanostructured Materials and Their Applications. Springer. Verlag Berlin Heidelberg.
- Naraghi, M. 2011. Carbon Nanotubes – Growth and Applications. InTech. Croatia.
- Capek, I. 2009. Dispersions, novel nanomaterial sensors and nanoconjugates based on carbon nanotubes. *Advances in Colloid and Interface Science*, 150:63-89.
- Watt, S. 2003. The Elements Silver. Marshall Cavendish Corporation, 1st Edition.
- Belval, B. 2007. Understanding the Elements of the periodic table: Silver. the Rosen publishing group, 1st Edition.
- Barberio M. et al 2014. Adsorption of Molecular Gases on Silver/Carbon Nanotube Composites at Low Temperatures and Low Pressures. *Journal of Chemistry*.
- Lin Z. D., Sheng-Joue Young et al 2013. Improved Field Emission Properties of Ag-Decorated Multi-Walled Carbon Nanotubes. *IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS*, 25(11).
- Mohan, R., Shanmugharaj, A. M. and Sung Hun, R. 2011. An efficient growth of silver and copper nanoparticles on multiwalled carbon nanotube with enhanced antimicrobial activity. *Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials*, 96B:119–126.
- Jagriti, N. et al 2012. Silver nanoparticles/multiwalled carbon nanotube/polyaniline film for amperometric glutathione biosensor. *International journal of biological macromolecules*, 50(3):672-678.
- Lehman, J. H. et al 2011. Evaluating the characteristics of multiwall carbon nanotubes. *CARBON*, 49:2581–2602.
- Saito, R. et al 2011. Raman spectroscopy of graphene and carbon nanotubes. *Advances in Physics*, 60(3):413–550.
- Dresselhaus, M. S. et al 2010. Perspectives on Carbon Nanotubes and Graphene Raman Spectroscopy. *Nano Lett*, 10 (3):751–758.
- Victor T.S., Wong and Wen J 2003. Micro and Nano Systems. Hong Kong university, HKSAR.